# 積分球を用いた Ce, Fe 置換 YAG セラ ミックスの光吸収スペクトル測定

川内職業能力開発短期大学校 蟹 江 知 彦

Optical Absorption Measurements of Ce, Fe doped YAG ceramics with the integral-ball Tomohiko KANIE

要約 不透明体試料の光吸収スペクトルを測定する場合、透明な単結晶及び薄膜などに用いられる透過型光吸収スペクトル測定装置を利用することは困難である。本研究では積分球を用いた反射法により均一共沈法により作製した Ce と Fe をドープした YAG セラミックスの光吸収特性を測定した。その結果2.7 eV 付近に Ce<sup>3+</sup>イオンの4f →5d 軌道励起遷移に伴う強い光吸収を、さらに1.0~2.2 eV の広範囲において Ce<sup>3+</sup>→ Fe<sup>3+</sup>間の電荷移動遷移と予想されるプロードな光吸収スペクトルを観測することができた。

## | はじめに

YIG (Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>)単結晶は現在光アイソレータ用材 料として利用されているが、近年このガーネット中の Y<sup>3+</sup>イオンの一部を Ce<sup>3+</sup>イオンに置換することにより 磁気光学効果であるファラデー特性が助長されること が発見された<sup>(1)</sup>。この大きな磁気光学効果の発生メカ ニズムには Ce<sup>3+</sup>イオンの軌道励起遷移によるもの、も しくは Ce<sup>3+</sup>ーFe<sup>3+</sup>間の電荷移動遷移によるものと考 えられているが、これらの遷移に伴う光吸収スペクト ルを測定することは困難であると言われている。すな わち Ce: YIG の光吸収スペクトルを測定した場合、 Fe<sup>3+</sup>イオンの3d →4f 軌道励起遷移及び3d 結晶場準位

 $(d\epsilon \ge d\gamma)$ 間の遷移に伴う光吸収が非常に大きいため、 $Ce^{3+}$ イオンの遷移による光吸収スペクトルがこれらの大きな光吸収により隠れてしまうためである。

そこで今回の実験では  $Fe^{3+}$ イオンの相当量を  $Al^{3+}$ に置換した  $Y_{3-x}Ce_xAl_{5-y}Fe_yO_{12}$  (Ce、Fe: YAG) セ ラミックス粉体を、組成コントロールが容易且つ原料 の原子オーダでの混合が可能な均一共沈法<sup>(2)</sup>により作 製し、その後一軸真空プレス・通常焼結によりバルク 化し光吸収測定を行った。作製したサンプルは不透明 体のため通常の透過型光吸収測定装置を使用するこが できないので、積分球を用いた反射法により測定を試 みた。

この結果、Ce<sup>3+</sup>イオンの遷移に伴う光吸収スペクト ルを観測することができたのでここに報告する。

#### II 電子遷移と光吸収<sup>(3)</sup>

#### 1. 電荷移動遷移

可視近傍の磁気光学効果を引き起こすと考えられる 金属イオンの電子遷移には電荷移動遷移、軌道励起遷 移、結晶場遷移の3種類がある。酸化物におけるイオ ン(M<sup>n+</sup>)の電子遷移についての説明を図1と図2に示 した。



 図 1 酸化物におけるイオン(M<sup>n+</sup>)の3種類の電子遷移と 電子雲<sup>(3)</sup>
(a)電荷移動遷移、(b)軌道励起遷移と結晶場遷移





電荷移動遷移は図1-aに示すように  $M^{n+}$ の配位 子イオンである  $O^{2-}$ から  $M^{n+}$ へ電子が飛び移る遷移で ある。 $M^{n+}$ として  $Fe^{3+}$ を考えると  $O^{2-}$ 電子が  $Fe^{3+}$ の3d 軌道に飛び移る遷移 (図2-a) が2.5 eV 以上の紫外 域に存在する。この遷移は許容遷移であるため振動子 強度 f が大きく、強い光吸収と大きな磁気光学効果を 与えるが、そのスペクトル (二遷移型)のすそが可視 ~近赤外領域まで広がっているのでフェライトの磁気 光学効果に最も重要な寄与をしている。

Ce:YIGではCe置換量の増加に伴いファラデー 回転が増大する。この原因としてCe<sup>3+</sup>とFe<sup>3+</sup>間の電 荷移動遷移が関与しているという説がある。これは次 の反応を進めるうえで必要な遷移である。

 $Ce^{3+} \rightarrow Ce^{4+} + e^{-}$ 

 $Fe^{3+}$ + e  $\rightarrow$   $Fe^{2+}$ 

この電荷移動は本来許容されない遷移であるが、格 子の歪によって部分的に許容されると考えられてい る。図3に鉄ガーネット中におけるFeイオン及びCe イオンのエネルギーレベルを示す<sup>(4)</sup>。ここで図中の矢 印は電荷移動遷移を表しており、この遷移により一方 の矢印は2.1 eV を中心とした、またもう一方は1.5 eV を中心とした光吸収を与える。

### 2. 軌道励起遷移

この遷移は $M^{n+}$ の一つの電子軌道からそれよりも 量子数の大きな別の軌道に移る遷移(図1-b)であ り、 $Fe^{3+}$ の3d  $\rightarrow$ 4p 遷移(図2-b)、 $Pr^{3+}$ の4f  $\rightarrow$ 5d 遷 移などがある。一般に軌道励起遷移は電荷移動遷移よ りも高エネルギー側に存在し非常に強い光吸収を与え



図 3 鉄ガーネット中における Fe イオン及び Ce イオ ンのエネルギーレベル<sup>(4)</sup>

る。Ce: YIG の場合約2.7 eV 付近に4f  $\rightarrow$ 5d 軌道励起 遷移に伴う強い光吸収が生じることが予想されてお り、この遷移により磁気光学効果が助長されていると いう説もある。

なお Pr 置換 ガーネット や Nd 置換 ガーネット で は、Pr や Nd の置換量の増大に伴ないファラデー回転 が増大する。その原因は Pr<sup>3+</sup>(Nd<sup>3+</sup>)の4f  $\rightarrow$ 5d 軌道励 起によって生じた励起状態の5d 電子が大きなスピ ン・軌道結合定数( $\xi$ )を持つためと考えられている。

#### 3. 結晶場遷移

 $M^{n+}$ の一つの電子準位が結晶場によって分裂し、そ の分裂準位の間で起こる遷移(図1-b、図2-c) が結晶場遷移である。代表的なものとしては酸素四面 体もしくは八面体位置に置かれた  $Fe^{2+,3+}$ や  $Co^{2+}$ など の3d 結晶場準位 ( $d\epsilon \ge d\gamma$ )間の遷移や、希土類イオ ン ( $R^{3+}=Eu^{3+}, Dy^{3+}, Er^{3+}$ など)の4f 電子の多重項間 の遷移などがある。

Fe<sup>3+</sup>の3d 電子の結晶場遷移は1~3 eV で起こり、光 吸収が小さいウインドー領域の高エネルギー側の吸収 端(バンドエッジ)を決定している。この遷移は本来 スピン及びパリティ禁制であるため、振動子 f があま り強くなく磁気光学効果をわずかしか増大させない。

## ||| 試料作製と光吸収スペクトル測定法

#### 1. Ce、Fe 置換 YAG セラミックスの作製

CeCl<sub>3</sub>, YCl<sub>3</sub>, AlCl<sub>3</sub>及び FeCl<sub>3</sub>を初期原料としアル カリ源に尿素を用いた均一共沈法によりセラミックス 微紛末を作製し、これを一軸真空プレスにより直径約 20 mm、厚さ約2 mm 程度の円板状圧粉体とした。こ の圧粉体を800~1000℃で空気中通常焼結することに よりバルクのCe、Fe置換YAGセラミックスを作製 した。具体的な作製方法を図4に示す。



図4 Ce、Fe 置換 YAG セラミックスの作製方法

## 2. 光吸収スペクトル測定法

積分球を用いた光吸収スペクトル測定方法について 述べる。通常、透明な試料の光吸収スペクトルを測定 する場合には透過法を用いるが、不透明体試料の測定 を行う場合にはこの測定方法では光が十分に透過しな いため測定不可能となる。そこで今回の実験では試料 が不透明で、且つ表面が比較的粗い状態でも測定が可 能と思われる積分球を用いた反射法により光吸収スペ クトルの測定を行った。図5にその測定系を示す。



#### 図5 積分球を用いた光吸収スペクトルの測定系

不透明体に当たった光は試料の表面から直接反射される鏡面反射光  $I_s$ と、試料の中で散乱された散乱反射 光  $I_{dr}$ に分けられる。 $I_{dr}$ は物質の吸収特性を持っている が  $I_s$ はない。従って表面が滑らかなものは  $I_s$ を除去す るようにして測定する必要がある。今回の実験では光 吸収として反射減光度を用い、これを以下のように定 義した<sup>(5)</sup>。

反射减光度 (reflex attenuance)

=10 log(
$$(I_s + I_{dr})/I_o$$
)  
=10 log( $I/I_o$ )

I。:標準白板(校正用)を用いた時の積分球からの光 出力レベル

I:試料を用いた時の積分球からの光出力レベル

## Ⅳ 測定結果

図 6 に積分球を用いた反射法により測定した Y<sub>3</sub> Al<sub>4.7</sub>Fe<sub>0.3</sub>O<sub>12</sub>の光吸収スペクトル及び XRD 測定結果 を示す。この図より h<sub>ν</sub>=2.54、1.97、1.38 eV 付近に



図 6 Y<sub>3</sub>Al<sub>4.7</sub>Fe<sub>0.3</sub>O<sub>12</sub>光吸収スペクトル及び XRD 特 性

小さな吸収ピークが現れていることがわかるが、これ はFe<sup>3+</sup>イオンの結晶場遷移によるものである<sup>(6)</sup>。Fe<sup>3+</sup> イオンの置換量が少ないにも関わらずこのような結晶 場遷移による吸収ピークが観測可能なことから、本測 定法は I<sub>s</sub>の影響をあまり受けず比較的感度良く測定が 可能なことがわかった。

次に焼成温度を変化させた場合について述べる。焼 成温度が800℃の時は XRD 結果より、この試料はまだ アモルファス状態であることがわかる。この時 Fe<sup>3+</sup>イ オンの結晶場遷移に伴う吸収ビークは強く現れていな い。焼成温度を850~1000℃に上げると850℃でガー ネットが生成し、温度上昇に伴いX線ビーク強度が次 第に強くなり、且つ結晶場遷移による吸収ビークが 除々に現れ始めることがわかる。



図7 Y<sub>2.9</sub>Ce<sub>0.1</sub>Al<sub>4.7</sub>Fe<sub>0.3</sub>O<sub>12</sub>光吸収スペクトル及び XRD 特性

図7にY<sub>2.9</sub>Ce<sub>0.1</sub>Al<sub>4.7</sub>Fe<sub>0.3</sub>O<sub>12</sub>の光吸収スペクトル及 びXRD 測定結果を示す。焼成温度が800℃の時、試料 はガーネットが生成されていないためCe<sup>3+</sup>の電子遷 移による光吸収ピークは現れていない。試料を850℃ で焼成するとXRD のピーク強度は比較的弱いものの ガーネットが生成され、これにより2.7 eV 付近に Ce<sup>3+</sup>の4f →5d 軌道励起遷移に伴う吸収が生じる。また これと同時に1.0~2.2 eV 付近にCe<sup>3+</sup>→ Fe<sup>3+</sup>電荷移 動遷移に伴う非常にブロードな吸収スペクトルが現れ 始める。ここで2.2 eV 付近から高エネルギー側へ向 かって緩やかな傾きをもつ吸収スペクトルはFe<sup>3+</sup>イ オン自身の電子遷移によるものである。

さらに焼成温度が1000℃まで上昇すると、電荷移動 遷移に伴う吸収スペクトルがより顕著に現れることが わかる。

図7と図6の測定結果を比較すると、図6ではガー ネットに Ce<sup>3+</sup>イオンをドーブしていないために Ce イ オンの電子遷移に伴う吸収スペクトルは現れていない ことがわかる。なお図6、7の吸収スペクトルにおい て1.7 eV 近傍に不連続がみられるが、これはフォトダ イオード等の測定系交換により発生したものである。

# V まとめ

均一共沈法により作製した Ce と Fe をドープした YAG セラミックスの光吸収特性を積分球を用いた反 射法により測定した結果、従来測定が困難であった Ce<sup>3+</sup>の4f  $\rightarrow$ 5d 軌道励起遷移及び Ce<sup>3+</sup> $\rightarrow$  Fe<sup>3+</sup>電荷移 動遷移に伴う光吸収スペクトルの測定を可能にするこ とができた。今後は Fe イオンのドープ量を変化した 場合の光吸収スペクトルを測定し、これによりガー ネット中への Ce ドープによるファラデー効果増大メ カニズムについて解明していきたい。

#### 謝 辞

本研究をまとめるに当たって、多大な御助言をいた だきました北陸先端科学技術大学院大学、材料科学研 究科五味学助教授に深く感謝いたします。

#### (参考文献)

- M. Gomi and M. Abe : Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 150, 121 (1989)
- (2) 日本セラミックス協会編:セラミックスの製造プロセス一粉末調整と成形一、p. 26, (1992)
- (3) 阿部正紀、五味学:応用物理57、p.723, (1988)
- M. Gomi, H. Furuyama and M. Abe: J. Appl. Phys, 70 (11), 1 (1991)
- (5) 吉永弘:応用分光ハンドブック p. 603-609,朝倉 書店 (1973)
- (6) D. L. Wood and J. P. Remeika : J. Appl. Phy, 38, p. 103 8-45 (1967)